

令和元年度 第36回
大型精密機器高度利用公開セミナー



走査型電子顕微鏡(SEM)の
使用方法

令和元年 12月16日 (月) 13:00 ~
岐阜大学総合研究棟II セミナー室

主催：岐阜大学 研究推進・社会連携機構 科学研究基盤センター 機器分析分野
協賛：日本化学会

令和元年度 第 36 回大型精密機器高度利用公開セミナー

「走査型電子顕微鏡(SEM)の使用方法」

日時：12/16(月) 10:00 ～ 17:30

<10:00 ～ セミナー室>

題目 1：走査電子顕微鏡 (SEM) の原理と観察テクニック

～SEM で何ができるのか～

良好な SEM 像を得るためには加速電圧、電流量などを最適条件で使用する事が重要です。基本に忠実に、すぐに使えるテクニックをご教示致します。

題目 2：SEM 試料前処理の基礎

～SEM 観察のために何が必要か～

SEM 像の出来栄の 8 割は前処理で決まる！と言われます。
様々なサンプルへの最適な前処理手法をご教示致します。

題目 3：EDX の原理と分析の基礎

EDX と電子顕微鏡の組み合わせは元素特定に非常に有効です。
原理の講演と最新の EDX 検出器をご紹介致します。

題目 4：魅せる観察へ！多目的走査電子顕微鏡 (SEM) の最新状況のご紹介

検出器の感度向上により、低真空、無蒸着条件でも高解像度な像取得が可能になってきております。最新アプリケーションをご紹介します

<昼食 1 時間>

<機器分析室 6 ～ 17:30>

題目 5：走査型電子顕微鏡 見学および実演講習

実際の装置を使って実演講習を行います。一緒に実サンプルにあわせた観察条件の検討を行いましょ。